УДК 533.9

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПЕРЕНОСА ВОЛЬФРАМА В ПЛАЗМЕ ТОКАМАКА Т-10

M.Р. Нургалиев¹, В.А. Крупин¹, Л.А. Ключников¹, А.Р. Немец¹, И.А. Земцов^{1, 2}, А.Ю. Днестровский¹, Д.В. Сарычев¹, В.С. Лисица¹, С.А. Грашин¹, Д.В. Рыжаков¹, Д.С. Сергеев¹, Н.А. Мустафин¹

Работа посвящена изучению переноса вольфрама в плазме токамака Т-10. Рассмотрен процесс аккумуляции вольфрама в центре плазмы в ОН-режимах и его зависимость от параметров n_e , I_p , $Z_{3\phi}$. В плазме с $Z_{3\phi}\approx 1$ —1,5 наблюдаются пикированные профили концентрации вольфрама $n_{\rm W}(r)$. В разрядах, загрязнённых лёгкими примесями ($Z_{3\phi}\approx 3$ —4), вольфрам в плазме в основном накапливается интегрально без существенного обострения профиля $n_{\rm W}(r)$ относительно профиля плотности электронов $n_e(r)$. В условиях литиезованной камеры Т-10 в плазме с $Z_{3\phi}\approx 1$ —1,5 наблюдаются на порядок более низкие концентрации вольфрама по сравнению с плазмой, загрязнённой лёгкими примесями. Устранение негативной аккумуляции вольфрама возможно путём введения дополнительного ЭЦР-нагрева (ЭЦРН). При центральном ЭЦРН профиль концентрации вольфрама уплощается, а величина его концентрации в центре уменьшается в \sim 10 раз на фоне увеличения поступления атомов вольфрама в разряд в \sim 4 раза.

Ключевые слова: токамак, вольфрам, примеси, перенос.

FIRST EXPERIMENTAL RESULTS OF TUNGSTEN TRANSPORT INVESTIGATIONS IN THE T-10 TOKAMAK PLASMA

M.R. Nurgaliev¹, V.A. Krupin¹, L.A. Klyuchnikov¹, A.R. Nemets¹, I. A. Zemtsov^{1, 2}, A.Yu. Dnestrovskij¹, D.V. Sarychev¹, V.S. Lisitsa¹, S.A. Grashin¹, D.V. Ryzhakov¹, D.S. Sergeev¹, N.A. Mustafin¹

The investigations of tungsten transport in T-10 plasma is presented in the current paper. The process of tungsten accumulation in OH discharges and its dependence on parameters n_e , I_p , $Z_{\rm eff}$ are discussed. Peaked tungsten density profiles $n_{\rm W}(r)$ are observed in plasmas with $Z_{\rm eff} \approx 1$ —1.5. In plasmas with $Z_{\rm eff} \approx 3$ —4, W accumulation is mainly integral with no profile peaking with regard to electron density $n_e(r)$. Lower densities of W are observed in discharges with lithized T-10 vacuum vessel in comparison with plasma contaminated with light impurities. The disposal of W accumulation is produced by auxiliary ECRH input. During the central ECRH the tungsten density profile flattens with the central density drop off by ~10 times together with W source increase up to 4 times.

Ключевые слова: tokamak, tungsten, impurity, transport.

DOI: 10.21517/0202-3822-2017-40-2-36-41

ВВЕДЕНИЕ

Одновременно с сооружением установки ИТЭР (экспериментального термоядерного реактора на базе токамака) продолжаются экспериментальные и теоретические исследования физических процессов, способных существенно повлиять на параметры его плазмы. Одним из направлений таких исследований является изучение свойств переноса примесей в плазме установок токамак. Собственные примеси способны оказывать негативное влияние на эффективность работы токамака-реактора путём разбавления термоядерного топлива лёгкими примесями и снижения температуры в зоне реакции из-за высокой излучательной способности тяжёлых примесей. Данные эффекты усугубляются наблюдающейся тенденцией к аккумуляции примесей в центре шнура, которая достигает наибольшей степени в разрядах с улучшенным удержанием и максимальными значениями параметров β_p и τ_E .

В современных установках токамак в качестве материалов первой стенки часто применяются углерод и вольфрам. На токамаке Т-10 в течение длительного времени использовались углеродные лимитеры (кольцевой и рельсовый). Однако в экспериментальной кампании 2015—2016 гг. они были заменены на аналогичные вольфрамовые. Дополнительно был установлен подвижный литиевый лимитер [1]. Замена материала лимитеров позволила провести исследования поведения вольфрама в плазме с омическим и ЭЦРН, а также сравнить его с полученными ранее зависимостями для поведения в плазме Т-10 средних (аргона Ar и калия K) [2] и лёгких (углерода С и кислорода О) [3, 4] примесей.

¹НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

²Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

¹NRC «Kurchatov Institute», Moscow, Russia

²Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Токамак Т-10 является установкой лимитерной конфигурации с круглым сечением и следующими параметрами: большой радиус R=1,5 м, малый радиус a=0,3 м, тороидальное поле $B_{\rm t} \le 2,5$ Тл, ток $I_{\rm p} \le 350$ кA, средняя плотность $\overline{n}_{\rm e} = (0,5-7)10^{19}$ м⁻³, мощность ЭЦРН $P_{\rm EC} \le 3$ МВт.

Диагностика вольфрама осуществляется при помощи измерений интегральных радиационных потерь в абсолютных величинах. С этой целью на T-10 установлена линейка из 16 коллимированных AXUV-детекторов, которые регистрируют профили интегрального линейчатого излучения ионов всех примесей во всём сечении шнура. Поступление в разряд вольфрама оценивается по интенсивности линии WI 4008 Å, измеряемой по хорде наблюдения, направленной на внутренние тайлы кольцевого лимитера, а также с помощью системы, сканирующей пространственное излучение линии WI 4008 Å в сечении В (рис. 1).

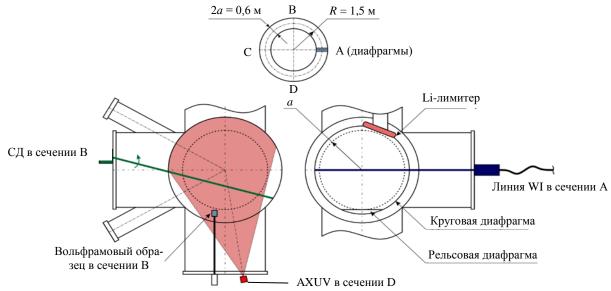


Рис. 1. Схема расположения диагностик токамака Т-10

Обоснованием к использованию профилей интегрального излучения ионов вольфрама для исследования транспортных свойств вольфрама является присутствие относительных концентраций ионов вольфрама $f_{\rm WZ} = n_{\rm WZ}/\Sigma n_{\rm WZ}$ на радиусах их коронального равновесия в шнуре. Для условий установки Т-10 данное обстоятельство было подробно исследовано в работе [6]. Также необходимо было установить, насколько надёжно свечение вольфрама выделяется на фоне общего излучения всех примесей, регистрируемого интегральной диагностикой AXUV, и в какой зоне шнура оно локализовано. Для этого в плазму в сечении В на радиус $r\approx 0.3$ м вводился вольфрамовый образец, являющийся копией тайла рельсового лимитера. Введение образца приводило к увеличению потоков вольфрама в плазму и к росту суммарных потоков вольфрама в разряд с вольфрамового образца и основной вольфрамовой диафрагмы.

Как видно на рис. 2, a, введение вольфрамового образца сопровождается заметным увеличением радиационных потерь из центральной зоны шнура ($r \le 20$ см). Наблюдаемая разница между профилями

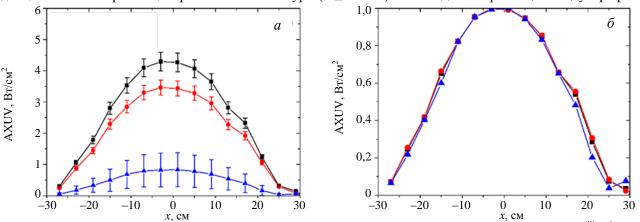


Рис. 2. Хордовые профили радиационных потерь, измеренные диагностикой AXUV в разрядах с I_p = 300 кA, \bar{n}_e = 2,2·10¹⁹ м⁻³: a — профили в абсолютных единицах; δ — профили, нормированные на центральную хорду; ■ — с вольфрамовым образцом; • — без вольфрамового образца; ▲ — разность Δ

свечения плазмы с образцом и без него позволяет оценить зону локализации свечения ионов вольфрама в шнуре. Для разряда с параметрами $I_p = 300$ кА, $\bar{n}_e \approx 2,2\cdot 10^{19}$ м $^{-3}$ размер зоны такой локализации составляет $r \le 15$ —20 см. Как показано далее, именно в этой зоне происходит интенсивное пикирование вольфрама. Следует отметить, что форма профилей свечения AXUV с вольфрамовым образцом и без него хорошо совпадает с формой разностного профиля внутри указанной области шнура (рис. 2, δ).

АККУМУЛЯЦИЯ ВОЛЬФРАМА В ПЛАЗМЕ Т-10

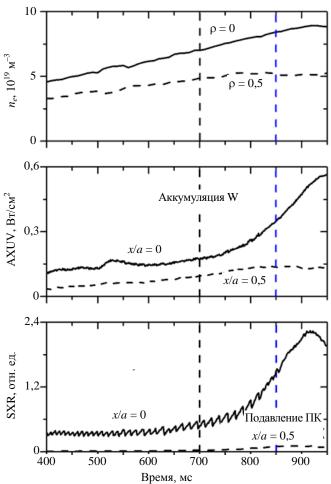


Рис. 3. Аккумуляция вольфрама в разряде № 67 993 с $I_{\rm p}=150~{\rm kA},\, \bar{n}_e=5.2\cdot 10^{19}~{\rm m}^{-3}$

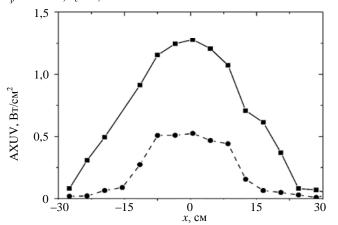


Рис. 4. Хордовые профили радиационных потерь, измеренные диагностикой AXUV: № 67 866 (•, без лития) ($I_p=220~\mathrm{kA},~\bar{n}_e=2.8\cdot10^{19}~\mathrm{m}^{-3},~Z_{3\varphi}\approx4$) и № 67 929 (•, с литием ×10) ($I_p=220~\mathrm{kA},~\bar{n}_e=2.2\cdot10^{19}~\mathrm{m}^{-3},~Z_{3\varphi}\approx1,1$)

Эксперименты показали, что в омических разрядах Т-10 наблюдаются существенно более пикированные у оси шнура профили радиационных потерь по сравнению с разрядами с С-лимитером. Рост излучения в центре связан прежде всего с процессом аккумуляции ионов вольфрама в центре шнура. В настоящей работе аккумуляция вольфрама рассматривается в виде двух взаимосвязанных процессов: накопления вольфрама (роста содержания вольфрама $n_{\rm W}/n_e$ без заметного обострения профиля $n_{\rm W}(r)$ и увеличения пикированности профиля $n_{\rm W}(r)$ относительно профиля электронов).

Анализ экспериментальных данных показывает, что процесс аккумуляции вольфрама наиболее ярко выражен в разрядах с малым током, большой плотностью и высоким $Z_{3\phi}$. Данный экспериментальный факт свидетельствует о существовании общих зависимостей от параметров разряда переноса ионов вольфрама и лёгких примесей, удержание которых, как показано в [4], улучшается с ростом параметра $\gamma = \overline{n}_e Z_{\text{ad}} / I_{\text{p}}^{1,5}$. Как показано на рис. 3, в разряде с предельной плотностью плазмы наблюдаются увеличение концентрации вольфрама в центре шнура и, соответственно, интенсивный рост излучения, которое, по всей видимости, приводит к охлаждению центра плазмы и уплощению профиля плотности тока. Последнее вызывает подавление пилообразных колебаний и, как следствие, дополнительное обострение профиля концентрации вольфрама и его радиационных потерь.

Наличие на Т-10 подвижного литиевого лимитера позволяет контролировать содержание лёгких примесей в плазме и тем самым провести сравнение поведения вольфрама в разрядах с разными значениями $Z_{3\varphi}$. Как показано на рис. 4, величина радиационных потерь, измеренных диагностикой AXUV, по центральной хорде в ~25 раз меньше в чистой плазме с $Z_{3\varphi} \approx 1,1$. С учётом температурной зависимости интегральных скоростных коэффициентов возбуждения вольфрама [7] можно говорить о сни-

жении концентрации вольфрама в центре чистой плазмы в \sim 10—20 раз. Более того, сравнение профилей концентрации вольфрама $n_{\rm W}(r)$ показывает, что в плазме с $Z_{\rm 9}$ \rightarrow 2 реализуются более широкие профили $n_{\rm W}(r)$, чем в чистых разрядах с литиезованной камерой (рис. 5).

Уменьшение концентрации вольфрама может быть объяснено зависимостью коэффициента аномальной диффузии плазмы от параметров разряда. Как было впервые показано на Т-10 [2], величина аномальной диффузии снижается с увеличением параметра $Z_{2\Phi}$. Таким образом, в плазме с большими величинами $Z_{3\Phi} \geq 3$ аномальные потоки примесей, направленные наружу и стремящиеся расширить профиль $n_{\rm W}(r)$ до профиля $n_{\rm e}(r)$, оказываются сравнимыми по величине с неоклассическими по-

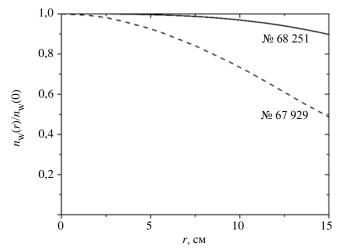


Рис. 5. Сравнение профилей концентрации вольфрама в чистой и грязной плазме: № 67 929 ($I_{\rm p}=220$ кА, $\bar{n}_e=2,2\cdot10^{19}~{\rm m}^{-3},$ $Z_{\rm 9\varphi}\approx1,1$) и № 68 251 ($I_{\rm p}=220$ кА, $\bar{n}_e=2,7\cdot10^{19}~{\rm m}^{-3},$ $Z_{\rm 9\varphi}\approx3,2$)

токами, вызывающими аккумуляцию примеси в центре плазмы. Однако в плазме с высоким содержанием лёгких примесей, где преобладают примесь-примесные столкновения, происходит снижение неоклассического пинчевания, задаваемого отношением [8]

$$\frac{V_{\text{neo}}^Z}{D_{\text{neo}}^Z} = \frac{Z}{Z_d} \left(\frac{\nabla n_d}{n_d} + \frac{H}{K} \frac{\nabla T_i}{T_i} \right), \tag{1}$$

где $V_{\rm neo}^Z$, $D_{\rm neo}^Z$ — неоклассический коэффициент диффузии примеси с зарядом Z, $Z_d=1$ заряд дейтонов; n_d — концентрация дейтонов; H и K — коэффициенты, зависящие от $n_Z Z^2/n_d Z_d^2$ и столкновительности ионов v_i^* . В случае плазмы с высоким $Z_{\rm sph}$ в выражении (1) следует учитывать примесь-примесные столкновения и заменить Z_d на заряд доминирующей лёгкой примеси с Z>1. Иными словами, уменьшается соотношение $V_{\rm neo}^Z/D_{\rm neo}^Z$, а вместе с ним и пикирование профилей концентрации примесей.

Можно заключить, что наблюдаемая аккумуляция вольфрама в плазме Т-10 носит неоклассический характер. Для подтверждения данного вывода было проведено описание указанных эффектов в транспортном коде STRAHL, представленное в работе [6].

ПОДАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯЦИИ ВОЛЬФРАМА ПРИ ЭЦРН

Возможность использования ЭЦРН для предотвращения аккумуляции примесей неоднократно демонстрировалась на многих установках (см., например, [3, 9—12]). Исследования показывают, что при включении ЭЦРН наблюдаются увеличение коэффициентов аномального переноса плазмы, разрушение неоклассической аккумуляции примесей в центре шнура и уплощение профилей концентрации примесей до профиля плотности электронов.

На Т-10 удаление вольфрама сопровождается изменением хордовых профилей радиационных потерь, регистрируемых болометрами и детекторами AXUV. Как показано на рис. 6, происходят быстрый спад излучения плазмы в центре и его рост на периферии. При этом возникают ски-

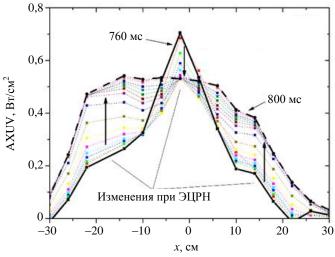


Рис. 6. Изменение хордовых профилей радиационных потерь после включения ЭЦРН на 760 мс разряда № 68 041 ($I_p = 180$ кA, $\bar{n}_e = 4.3 \cdot 10^{19}$ м $^{-3}$)

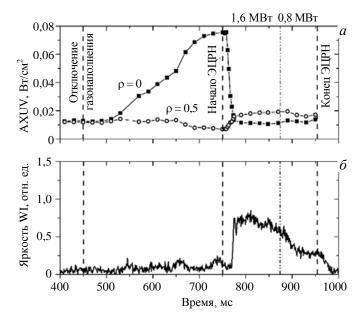


Рис. 7. Плотность мощности радиационных потерь при ЭЦРН сильно спадает в центре (a) и слабо вырастает на периферии шнура (δ) одновременно с увеличением яркости линии WI 4008 Å в разряде № 68 086 ($I_{\rm p} = 220$ кА, $\bar{n}_e = 4,5 \cdot 10^{19}$ м $^{-3}$)

нированные радиальные профили радиационных потерь (рис. 7). Такой значительный спад радиационных потерь в центре обеспечен уходом из него излучающих ионов вольфрама. Процесс удаления вольфрама протекает на фоне значительного роста свечения линии WI (4008 Å), которое свидетельствует о многократном увеличении поступления вольфрама в плазму с поверхности вольфрамового лимитера при ЭЦРН.

Эксперимент показывает, что в процессе ЭЦРН содержание вольфрама в центре падает примерно в 10 раз, профиль радиационных потерь уплощается. Учитывая увеличение поступления вольфрама в 3—4 раза, можно заключить, что эффективность удаления вольфрама из центра плазмы составляет ~30—40, в то время как у лёгких примесей такое соотношение ~10—20 [4]. Таким образом, вольфрам удаляется из плазмы эффективнее лёгких примесей даже с учётом разброса в величинах скоростных коэффициентов интегрального возбуждения ионов вольфрама [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены первые результаты по исследованию переноса вольфрама в омических и ЭЦР-режимах работы токамака Т-10. В омических разрядах вольфрам, как и ожидалось, сильно аккумулируется (т.е. накапливается и пикируется) в центре плазменного шнура. Процесс имеет неоклассическую природу и в ОН-режимах с плотностью $n_e \ge 2 \cdot 10^{19} \, \mathrm{m}^{-3}$ и током $I_\mathrm{p} \le 250 \, \mathrm{kA}$ заканчивается подавлением пилообразных колебаний вследствие постепенной аккумуляции вольфрама у оси и пикировки радиационных потерь. Наблюдаются схожие зависимости характеристик удержания лёгких, средних и тяжёлых примесей плазмы Т-10 от параметра $\gamma = \overline{n}_e Z_{\mathrm{эф}} / I_\mathrm{p}^{1.5}$. Однако для уточнения деталей подобных зависимостей необходимы более подробные исследования.

Эффективным способом удаления вольфрама из плазмы в условиях T-10 является литиезация камеры, в результате которой концентрация вольфрама в центре снижается более чем в 10 раз. Введение дополнительного ЭЦРН также приводит к выносу вольфрама из центра. В разрядах с предельной аккумуляцией вольфрама это уменьшение может достигать ~10 раз.

Работа выполнена за счёт гранта Российского научного фонда № 14-22-00193. Эксперименты с литиевым лимитером выполнены при поддержке Госкорпорации «Росатом» (контракт № Н.4х.241.9Б.17.1011).

REFERENCES

- 1. Sarychev D.V. et al. In: 26th IAEA Fusion Energy Conf. Kyoto, 2016, OV/4—5.
- 2. Krupin V.A. et al. In: 12th EPS Conf. on Plasma Physics. Budapest, 1985, pp. 207—210.
- 3. Klyuchnikov L. et al. In: 25th IAEA Fusion Energy Conf. St. Petersburg, 2014, EX/P1–44.
- 4. Nurgaliev M. In: 43rd EPS Conf. on Plasma Physics. Leuven, 2016, P2. 069.
- 5. **Klyuchnikov L.A. et al.** Review of Scientific Instruments, 2016, vol. 87, p. 053506.
- 6. **Zemtsov I.A. et al.** VANT. Ser. Termoyadernyi sintez (Problems of Atomic Science and Technology. Ser. Thermonuclear Fusion), 2017 (in press) (in Russian).
- 7. **Demura A. et al.** Atoms, 2015, vol. 3, pp. 162—181.

- 8. **Hinton F.L., Hazeltine R.D.** Review of Modern Physics, 1976, vol. 48, № 2, Part I, pp. 239—308.
- 9. **Tanabe T. et al.** J. of Nuclear Materials, 2000, vol. 283—287, pp. 1128—1133.
- 10. Neu R. et al. Plasma Phys. Control. Fusion, 2002, vol. 44, pp. 811—826.
- 11. **Sertoli M. et al.** Plasma Phys. Control. Fusion, 2011, vol. 53, p. 035024.
- 12.**Hong J. et al.** Nucl. Fusion, 2015, vol. 55, p. 063016.
- 13.**Demura A., Kadomtsev M., Lisitsa V., Shurygin V**. Atoms, 2015, № 3, pp. 162—181.

AUTHORS

Nurgaliev M.R. NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia

Krupin V.A. NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia

Klyuchnikov L.A. NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia; lklyuchnikov@list.ru

Nemets A.R. NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia; Nemets_AR@nrcki.ru

Zemtsov I.A., NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia; N.E.Bauman MSTU, 2-ya Baumanskaya str. 5, 105005 Moscow, Russia

Dnestrovskij A.Yu. NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia

Sarychev D.V. NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia

Lisitsa V.S. NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia; vlisitsa@yandex.ru

Grashin S.A. NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia; SAGrashin@nrcki.ru

Ryzhakov D.V. NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia; ryjakovdv@gmail.com

Sergeev D.S. NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia

Mustafin N.A. NRC "Kurchatov Institute", pl. Akademika Kurchatova 1, 123182 Moscow, Russia; nikitamustafin@gmail.com

Received 2 February 2017
Problems of Atomic Science and Technology
Ser. Thermonuclear Fusion, 2017, vol.40, issue 2, pp. 36—41.